PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-140612

(43) Date of publication of application: 20.05.1994

(51)Int.CI.

H01L 27/14 H04N 5/335 BEST AVAILABLE COPY

(21)Application number: 04-316197

NU4N 3/333

(71)Applicant: MITSUBISHI ELECTRIC CORP

(22)Date of filing:

28.10.1992

(72)Inventor: KAWASHIMA HIKARI

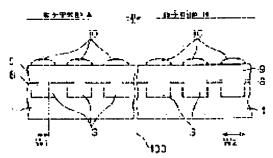
NISHIOKA YASUTAKA

YAMAWAKI MASAO

(54) IMAGE PICK-UP ELEMENT AND IMAGE PICK-UP DEVICE

(57) Abstract:

PURPOSE: To provide an image pick-up device which provides uniform signal outputs from the whole screen by each diaphragm even when the effective diameter of an image forming lens is small. CONSTITUTION: A light shielding layer 8 is provided so as to limit incident light on each picture element 3 of an image pickup element 100. A light shielding layer opening corresponding to the picture element of a center part A of the picture element part of the image pick-up element is permitted to be small and an opening corresponding to the picture element of the edge part B of the picture element part is permitted to be large. The nonuniformity of the incident light quantities on the center part A and at the edge part B of the image pick-up element, which is caused by the eclipse by an image forming lens, is corrected at a stage of light incidence on each picture element.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-140612

(43)公開日 平成6年(1994)5月20日

(51)Int.Cl. ⁵	識別記号	庁内整理番号	FI	技術表示箇所
H01L 27/14				
H 0 4 N 5/335	v			

7210-4M H 0 1 L 27/ 14 E

審査請求 未請求 請求項の数5(全 11 頁)

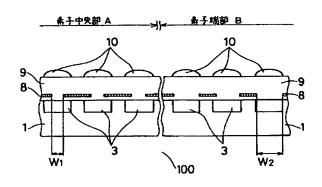
(21)出願番号	特顧平4316197	(71)出願人 000006013 三菱電機株式会社
(22)出顧日	平成4年(1992)10月28日	東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 (72)発明者 川島 光 兵庫県伊丹市瑞原4丁目1番地 三菱電機 株式会社エル・エス・アイ研究所内
		(72)発明者 西岡 康隆 兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機 株式会社エル・エス・アイ研究所内
		(72)発明者 山脇 正雄 兵庫県伊丹市瑞原 4 丁目 1 番地 三菱電機 株式会社エル・エス・アイ研究所内
		(74)代理人 弁理士 早瀬 憙一

(54)【発明の名称】 撮像素子及び撮像装置

(57)【要約】

【目的】 結像レンズの有効径が小さくとも、各絞りに おいて全画面にわたって均一な信号出力を得ることがで きる撮像装置を得る。

【構成】 撮像素子100の各画素3に入射する光を制限する遮光層8を、撮像素子の画素部の中央部分Aの画素に対応する開口部を狭く、画素部の端部Bの画素に対応する開口部を広くし、結像レンズでのケラレによる撮像素子の中央部分と端部への入射光量の不均一を各画素に入射する段階で補正するようにした。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板上に複数の画素を配置してなる画案 部と、該画素部の各画素に対応した開口部を有する遮光 層とを有する撮像素子において、

上記遮光層は、上記画素部の中央部分の画素に対応する 開口部の開口幅が上記画素部の端部の画素に対応する開 口部の開口幅よりも狭く形成されていることを特徴とす る撮像素子。

【請求項2】 基板上に複数の画素を配置してなる画素 部と、該画素部の各画素に対応して設けられたマイクロ 10 レンズとを有する撮像素子において、

上記画素部の中央部分の画案に対応して設けられたマイクロレンズの曲率が上記画素部の端部の画素に対応して 設けられたマイクロレンズの曲率よりも小さいことを特 徴とする損像素子。

【請求項3】 被写体像を結像するための結像レンズと、該結像レンズにより結像された光像を電気信号に変換するための撮像素子とを備えた撮像装置において、

上記撮像素子は、基板上に複数の画素を配置してなる画素部と、該画素部の各画素に対応した開口部を有する遮 20 光層とを有するものであり、かつ上記遮光層は、上記画素部の中央部分の画素に対応する開口部の開口幅が上記画素部の端部の画素に対応する開口部の開口幅よりも狭く形成されていることを特徴とする撮像装置。

【請求項4】 被写体像を結像するための結像レンズと、該結像レンズにより結像された光像を電気信号に変換するための撮像素子とを備えた撮像装置において、

上記撮像素子は、基板上に複数の画素を配置してなる画素部と、該画素部の各画素に対応して設けられたマイクロレンズとを有するものであり、かつ、上記画素部の中30央部分の画素に対応して設けられたマイクロレンズの曲率が上記画素部の端部の画素に対応して設けられたマイクロレンズの曲率よりも小さいことを特徴とする撮像装置。

【請求項5】 被写体像を結像するための結像レンズと、該結像レンズにより結像された光像を電気信号に変換するための撮像素子とを備えた撮像装置において、結像レンズの絞り値を入力とし、当該絞り値において結像レンズの周辺光のケラレにより生ずる撮像素子の各画素の信号出力の面内不均一を補正するための信号を出力 40する補正信号発生手段と、

上記撮像素子の出力を上記補正信号発生手段が出力する 信号を用いて補正する信号処理手段とを備えたことを特 徴とする撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】との発明はビデオカメラ、スチルカメラ、監視用カメラ等の撮像装置に関し、特に結像レンズによる光のケラレにより生ずる撮像素子の中央部分と端部での信号出力の不均一を補正できる撮像装置及び

撮像案子に関するものである。

[0002]

【従来の技術】図11はレンズを通して、被写体を撮像 素子に結像する様子を示す模式的な光線図である。図に おいて、11は被写体像を結像するための結像レンズ、 12は結像面、13は射出瞳面を示し、図中の一点鎖線 は光線の軌跡を示す。また、aは射出瞳位置、fはパッ クフォーカス、rはレンズの有効径、hは像面高、s, t,iはそれぞれ角度を示す。

【0003】また、図12は従来の撮像装置において、図11の結像面12に配置されるIT-CCD撮像素子の構造を示す断面図である。図において、1はn型シリコン基板、2は第1p型層よりなるウェル領域、3は第1n型層よりなる受光部、4は第2n型層よりなるCCDチャネル領域、5は第2p型層よりなるチャネル分離領域、6はシリコン酸化膜よりなるゲート絶縁膜、7はポリシリコン膜よりなるゲート電極、8はCCDへ入射する光を遮るアルミ等からなる遮光膜、9は平坦化層、10はマイクロレンズである。100は撮像素子である

【0004】図13は撮像素子の複数の画素が配置された画素部全体を示す上面図であり、図において、oは撮像素子の中心であり、一般に、撮像素子はこの中心oが結像レンズの光軸上に位置するように結像面に配置される。またa,b,cは撮像素子のX-X線上の画面位置を示している。またAは撮像素子の中央部分、Bは撮像素子の周辺部分であり、説明の便宜のために区分して示したものである。

【0005】次に動作について説明する。図11において、図示しない被写体からレンズ11に入った光は結像面12で結像する。この時、レンズ中心を通る光線はレンズのF値により入射角tの角度の光束を結像する。F値と入射角tの間には、

 $t = \sin^{-1}(1/2F)$

の関係がある。即ち、入射角 t は絞りを開放側にするほど大きくなる。

【0006】結像面12に配置される撮像素子上には、本来、その画面上のいずれの位置においても同様の光束が入るべきであり、このためには、像面高hの撮像素子を用いる場合では、以下のような有効径を備えたレンズが必要となる。

【0007】撮像素子端部を通る主光線は、レンズ中心を通った主光線と射出瞳位置で角度 i で交わる。角度 i は、

 $i = tan^{-1} (h/a)$

で、また、撮像素子端部を通る主光線と最周辺光線のな す角度 s は、

s≒t

ンズによる光のケラレにより生ずる撮像素子の中央部分 で近似できる。従って、バックフォーカス f ,射出瞳位 と端部での信号出力の不均一を補正できる撮像装置及び 50 置 a のレンズで、像面高 h の撮像素子を用いる撮像装置 3

の絞りF時のレンズ必要径rは、

 $r = 2 \times (f \times tan(t+i)+h)$ = $2 \times [f \times tan(sin^{-1}(1/2F) + tan^{-1}(h/a)) + h]$

となる。

【0008】ところで、従来の撮像装置では、撮像装置の小型、軽量化のため結像レンズ径を小さくする要望があり、サイズ(像面高h)の同じ撮像素子を用い、結像レンズ径のみを小さくするような場合には、F値を開放側として使用する際にレンズ11の有効径が上述の必要径を満足していないものとなる。

【0009】即ち、このような撮像装置では、絞りを、レンズの有効径と撮像紫子の像面高で決まる所定のF値よりも非開放側として使用する際は、撮像紫子の画面上のいずれの位置においても同様の光束が入射するが、絞りを、レンズの有効径と撮像紫子の像面高で決まる所定のF値よりもさらに開放側にしたときにはレンズ周辺部で生ずる光のケラレが撮像紫子に結像される光束の光量に影響を及ぼし、撮像紫子の端部に結像される光束の光量が低下する。

【0010】一方、図12に示すように、従来の撮像装 20 置に用いられる撮像素子では、素子中央部Aの画素と素子端部Bの画素は、マイクロレンズ10の形状、遮光層8の開口幅を含めて同一の構造を有し、各画素に対し入射する光束が同様のものであれば各画素からは均一の信号出力が得られる。しかし、上述したように従来の撮像装置では、撮像素子上に被写体を結像するために使用するレンズの有効径が小さいので、レンズの絞りを開放側にしていくと、撮像素子端部側からその入射光量が低下し、素子中央部の画素に比して素子端部の画素の信号出力は低くなる。図14はこの様子を示す図であり、縦軸30は各F値の信号出力を画面中央値で規格化した値を、横軸は画面の位置を示す。図14中の画面位置 a, b, c はそれぞれ図13において、oを中心とし、oa, o b, ocを半径とする同心円上の位置を示す。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】従来の撮像装置では、 上述のように、撮像素子上に被写体を結像するための結 像レンズの有効径が必要径を満足していないため、絞り を開放側にしていくと、結像レンズの端部で生じる光の ケラレにより、撮像素子の中央部の画素と端部の画素と の信号出力の不均一が生じ、画面の周囲が中央部分に比 して暗くなるという問題点があった。

【0012】との発明は上記のような問題点を解消するためになされたもので、撮像素子上に被写体を結像するためのレンズの有効径が小さい場合でも、各絞り時に、全画面にわたって均一な信号出力を得ることができる撮像装置を得ることを目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】との発明に係る撮像素子 素に対応する開口部の開口幅よりも狭く形成された遮光は、基板上に複数の画素を配置してなる画素部と、該画 50 層を備えた構成とした、又は、画素部の中央部分の画素

累部の各画案に対応した開口部を有する遮光層とを有するのにおいて、上記遮光層が、上記画素部の中央部分の画素に対応する開口部の開口幅が上記画素部の端部の画素に対応する開口部の開口幅よりも狭く形成されたものである。

【0014】また、この発明に係る撮像素子は、基板上に複数の画素を配置してなる画素部と、該画素部の各画素に対応して設けられたマイクロレンズとを有するものにおいて、上記画素部の中央部分の画素に対応して設けられたマイクロレンズの曲率が上記画素部の端部の画素に対応して設けられたマイクロレンズの曲率よりも小さいものである。

【0015】また、この発明に係る撮像装置は、被写体像を結像するための結像レンズと、該結像レンズにより結像された光像を電気信号に変換するための撮像素子とを備えたものにおいて、上記撮像素子を、基板上に複数の画素を配置してなる画素部と、該画素部の各画素に対応した開口部を有する遮光層とを有するものとし、かつ上記遮光層を、上記画素部の中央部分の画素に対応する開口部の開口幅が上記画素部の端部の画素に対応する開口部の開口幅が上記画素部の端部の画素に対応する開口部の開口幅よりも狭く形成されたものとしたものである。

【0016】また、この発明に係る撮像装置は、被写体像を結像するための結像レンズと、該結像レンズにより結像された光像を電気信号に変換するための撮像素子とを備えたものにおいて、上記撮像素子を、基板上に複数の画素を配置してなる画素部と、該画素部の各画素に対応して設けられたマイクロレンズとを有するものとし、かつ、上記画素部の中央部分の画素に対応して設けられたマイクロレンズの曲率を上記画素部の端部の画素に対応して設けられたマイクロレンズの曲率よりも小さくしたものである。

【0017】また、この発明に係る撮像装置は、被写体像を結像するための結像レンズと、該結像レンズにより結像された光像を電気信号に変換するための撮像素子とを備えたものにおいて、結像レンズの絞り値を入力とし、当該絞り値において結像レンズの周辺光のケラレにより生ずる撮像素子の各画素の信号出力の面内不均一を補正するための信号を出力する補正信号発生手段と、上記撮像素子の出力を上記補正信号発生手段が出力する信号を用いて補正する信号処理手段とを備えたものである。

[0018]

【作用】この発明における撮像素子は、画素部の中央部分の画素に対応する開口部の開口幅が画素部の端部の画素に対応する開口部の開口幅よりも狭く形成された遮光層を備えた機成とした。又は、画素部の中央部分の画素

に対応して設けられたマイクロレンズの曲率を画衆部の 端部の画案に対応して設けられたマイクロレンズの曲率 よりも小さくしたので、画索部端部に入射する光の量が 画素部中央部に入射する光の量よりも少ない場合に、画 累部の端部の画素の出力レベルと画素部の中央部分の画 素の出力レベルを均一なものとできる。従ってこれを撮 像装置の結像レンズにより結像された光像を電気信号に 変換するための素子として用いた場合には、結像レンズ のケラレにより画面の周囲が中央部分に比して暗くなる 現象を抑制することができる。

【0019】また、この発明における撮像装置は、結像 レンズにより結像された光像を電気信号に変換するため の撮像素子を、基板上に複数の画素を配置してなる画素 部と、該画素部の各画素に対応した開口部を有する遮光 層とを有するものとし、かつ上記遮光層を、上記画素部 の中央部分の画素に対応する開口部の開口幅が上記画素 部の端部の画素に対応する開口部の開口幅よりも狭く形 成されたものとしたので、結像レンズでのケラレによる 撮像素子の中央部分と端部への入射光量の不均一を各画 素に入射する段階で補正することができ、画面の周囲が 20 中央部分に比して暗くなる現象を抑制することができ る。

【0020】また、この発明における撮像装置は、結像 レンズにより結像された光像を電気信号に変換するため の撮像素子を、基板上に複数の画素を配置してなる画素 部と、該画素部の各画素に対応して設けられたマイクロ レンズとを有するものとし、かつ、上記画素部の中央部 分の画素に対応して設けられたマイクロレンズの曲率を 上記画素部の端部の画素に対応して設けられたマイクロ レンズの曲率よりも小さくしたので、結像レンズでのケ 30 ラレによる撮像素子の中央部分と端部への入射光量の不 均一を各画素に入射する段階で補正することができ、画 面の周囲が中央部分に比して暗くなる現象を抑制すると とができる。

【0021】また、この発明における撮像装置は、結像 レンズの絞り値を入力とし、当該絞り値において結像レ ンズの周辺光のケラレにより生ずる撮像素子の各画素の 信号出力の面内不均一を補正するための信号を出力する 補正信号発生手段と、上記撮像素子の出力を上記補正信 号発生手段が出力する信号を用いて補正する信号処理手 40 段とを備えた構成としたので、各絞り時に、全画面にわ たって均一な信号出力を得ることができる。

[0022]

【実施例】以下、この発明の実施例を図について説明す

実施例1.図1は本発明の第1の実施例による撮像装置 に用いる撮像素子を模式的に示す断面図であり、図にお いて、図12と同一符号は同一又は相当部分である。本 実施例に用いる撮像素子の構造は基本的には図12の従 例では遮光膜8の開口幅w1. w2 は累子中央部Aでは 狭く、素子端部Bでは広く形成されている。なお、図1 では図面を簡単にするため、CCDチャネル領域、ゲー ト電極等を省略している。

【0023】また、図2はIT-CCD撮像索子の一画 素に対して光が入射する様子を示す図である。図におい て、20は画素に対応して設けられたマイクロレンズ1 0のある一点に入射する光束である。マイクロレンズ1 0は入射する光を屈折し、本来遮光膜で遮られて受光部 3に入らない光を集光し、実効的な開口率の向上を図る ものである。

【0024】図2の矢印20に示すように、実際の入射 光は、主光線からこの主光線に対し結像レンズの絞りに よって変化する角度 t をもつ最周辺光線までの光束で構 成され、遮光膜8の幅により図に示すようなケラレが生 じる。この関係を示したものが図3である。図3におい て、横軸は遮光膜8の開口のサイズを、縦軸は各F値に おける信号出力を開口サイズが大きいときの信号出力で 規格化したものを示す。

【0025】図に示すように、絞りをF4→F1.8と 開放側にするに従い、開口幅の変化が信号出力に及ぼす 影響が大きくなる。即ち遮光膜の開口幅を小さくすると とによる出力の低下は、絞りを開放側にするほど大きく なる。このような関係はマイクロレンズの形状、材料、 平坦化層の膜厚等によって一義的に決まる。

【0026】図1に示す本実施例の撮像素子は、この関 係を用いて結像レンズの絞りによるケラレを補正するも のであり、遮光膜の開口幅を、素子中央部から端部側に 向けて徐々に大きくなるように変化させている。具体的 には、例えば図13に示す画面位置aに相当する撮像素 子の画素の開口幅が図3に示す開口幅a、図13に示す 画面位置 b に相当する撮像素子の画素の開口幅が図3に 示す開口幅b、図13に示す画面位置cに相当する撮像 素子の画素の開口幅が図3に示す開口幅cとなるように 変化させている。

【0027】このように本実施例においては、結像レン ズの絞りに依存したケラレによる撮像出力の不均一を補 正するよう撮像素子内の遮光の幅を素子中央部と素子端 部で異ならせたので、各F値において均一な信号出力を 得るととができる。

【0028】実施例2.図4は本発明の第2の実施例に よる撮像装置に用いる撮像素子を模式的に示す断面図で あり、図において、図12と同一符号は同一又は相当部 分である。本実施例に用いる撮像素子の構造は基本的に は図12の従来の撮像素子と同じであるが、図に示すよ うに、本実施例では、素子中央部Aの画素と素子端部B の画素に設けられたマイクロレンズとでその形状を異な るものとしている。なお、図4では図1と同様、図面を 簡単にするため、CCDチャネル領域、ゲート電極等を 来の撮像素子と同じであるが、図に示すように、本実施 50 省略している。本実施例による撮像素子は、撮像装置の レンズによるケラレをマイクロレンズのケラレを利用し て補正するものである。

【0029】図5は一定のF値における、異なる曲率を 有するマイクロレンズのそれぞれについての遮光膜の開 口幅と集光率の関係を示すグラフ図である。図に示すよ うに、例えば開口幅Xにおいてみると、一定の絞りでは 曲率の小さい(曲率半径の大きい)マイクロレンズほど ケラレが大きくなることがわかる。

【0030】また、図6は開口幅が一定のときの、各F 値におけるマイクロレンズの曲率と信号出力との関係を 10 示すグラフ図である。図において、横軸はマイクロレン ズの曲率を、縦軸は各F値における信号出力を曲率が大 きいときの信号出力で規格化したものを示す。図に示す ように、絞りをF4→F1. 8と開放側にするに従い、 曲率の変化が信号出力に及ぼす影響が大きくなる。即ち マイクロレンズの曲率を小さくすることによる出力の低 下は、絞りを開放側にするほど大きくなる。このような 関係は遮光膜の開口幅、平坦化層の膜厚等によって一義 的に決まる。

【0031】図4に示す本実施例の撮像素子は、この関 20 係を用いて結像レンズの絞りによるケラレを補正するも のであり、マイクロレンズの曲率を、素子中央部から端 部側に向けて徐々に大きくなるように変化させている。 具体的には、例えば図13に示す画面位置aに相当する 撮像素子の画素のマイクロレンズの曲率が図6に示す曲 率a、図13に示す画面位置bに相当する撮像素子の画 素のマイクロレンズの曲率が図6に示す曲率 b、図13 に示す画面位置 c に相当する撮像素子の画素のマイクロ レンズの曲率が図6に示す曲率cとなるように変化させ

【0032】これにより、本実施例ではレンズ絞りが開 放状態に近づいた時の、結像レンズによるケラレにより 生ずる撮像索子の中央部と端部での信号出力の不均一 が、マイクロレンズのケラレで補正され、出力の均一性 の向上を図ることができ、上記第1の実施例と同様の効 果が得られる。

【0033】次に本実施例の撮像素子の製造方法につい て説明する。図7(a) ~(f) は本実施例の固体撮像素子 の製造方法を示す断面模式図であり、図において、14 は基板、3は受光部、9は平坦化層、15はマイクロレ 40 ンズ材料、16はフォトレジスト、17はマスクであ る。なお、各図中、右側は撮像素子の受光エリア端部 を、また左側は撮像素子の受光エリア中央部をそれぞれ 示している。

【0034】まず、図7(a) に示すように固体撮像素子 の作り込まれた基板 1 4 上に平坦化層 9, マイクロレン ズ材料 1 5 、及びフォトレジスト 1 6 を順次塗布する。 そして、写真製版の手法を用いて、図7(b) に示すよう に、マイクロレンズの元パターン16aを形成する。C のパターン16 a は受光エリア中央から外側にいくに従 50 3上に被写体を結像するための結像レンズ、72 は結像

い、同心円状にパターン面積が大きくなるように形成す

【0035】ととで使用するフォトレジスト16として はマイクロレンズ材料15の感光波長に対しマスクとな る吸収を有すること、マイクロレンズ材料15はフォト レジスト16の現像に対し耐性があること、等の条件か ら、例えばマイクロレンズ材料15として違紫外線に感 光するアクリル系ポジレジスト(東京応化製OEBR-1000、ODUR-1013等) を、フォトレジスト 16としてフェノール系のg線ポジ型レジスト(東京応 化製OFPR-800, JSR製PFR-3000等) を使用するのが有効である。

【0036】次に、このマイクロレンズの元パターン1 6aをマスクにして、マイクロレンズ材料15をドライ エッチングなどの手法を用いて加工し、元パターンを写 しとり、マイクロレンズパターン15aを形成する。続 いて、図7(c) に示すように、この上から元パターン1 6 a の外周部分の一部に光が当たるようにマスク17を かけて露光する。これにより、元パターン16 a の一部 を図7(d) に示すように取り除く。この取り除く面積 は、受光エリア中央から外側にいくに従い小さくなるよ うにする。このようにして形成されたレジストパターン 16 bをマスクにして、マイクロレンズパターン15 a を遠紫外光を用いて露光し、その後、レジストバターン 16bを取り除く。この時、マイクロレンズパターン1 5 a のうちレジストパターン 1 6 b のあった部分はこれ がマスクとなるため、光に感光しないが、パターン16 bのなかった部分(図7(e)の斜線部分)は感光し、ボ リマーの分子量が低下する。

【0037】 この後、 図7(f) に示すように基板を加熱 して、材料15を熱フローさせてマイクロレンズ10を 形成する。との時、分子量の低下した部分は軟化度が大 きくなるので、結果として中央部では薄いレンズが、周 辺では厚いレンズが形成され、図4に示すような撮像素 子を作製することができる。

【0038】実施例3.次に、本発明の第3の実施例に ついて説明する。レンズの絞りを変えると、同心円状に 光強度が変化することは前述の通りであるが、これを図 示すると、図8のようになる。 横軸はイメージセンサの 感光部の座標、縦軸は入射する光強度分布あるいはそれ に比例する信号出力を示している。**絞りを開くと、図で** 示すように、画面周辺部の信号出力が減少する。との減 少の度合いはイメージセンサの光学的構造と撮像に用い るレンズによって一義的に決まる。本実施例はこの関係 を用いて信号出力を補正回路を用いて均一化するもので ある。

【0039】図9は信号出力の補正を行う回路構成の一 例を示したものである。図において、73はイメージセ ンサ(撮像素子)である。また71はイメージセンサ7

レンズ内に組み込まれている絞り、74はイメージセンサ73からの信号出力に対しサンブルホールド、相関処理等の処理を行なう前置信号処理回路、75は前置信号処理回路74からのアナログ信号をディジタル信号に変換するA/D変換器である。79は後述するような補正のための情報が記憶されたROMである。78は例えばマイクロコンピュータ等のコントローラであり、絞り72から絞り値に関する情報を受けて、該絞り値に応じた補正のための情報をROM79より読み出し、読み出した情報に基づいて補正信号を生成するものである。76 10 はA/D変換器75からのディジタル信号をコントローラ78からの補正信号を用いて補正をかける補正回路、77は補正回路76で補正された信号に対し、増幅、同期信号付加等の処理を行なう信号処理回路である。

【0040】次に動作について説明する。被写体からの 光束は、結像レンズ71によりイメージセンサ(撮像素 子) 73上に結像される。このとき絞り72は被写体の 明るさに応じて調整される。絞り72を開放側にすると 結像レンズ71の端部における光のケラレにより、イメ ージセンサの画面端部の入射光量が画面中央部の入射光 20 量より少なくなる。イメージセンサ73の出力は前置信 号処理回路74及びA/D変換器75を通してディジタ ル信号とされるが、この信号は絞りに依存して画面中央 部と画面端部とで不均一なものとなっている。一方、絞 り72の絞り値に関する情報はコントローラ78に伝え られる。コントローラ78は絞り値に関する情報をもと に、ROM79から予め記憶された当該絞り値に対応す る補正に関する情報を読み出し、この読み出した補正に 関する情報に基づいて補正信号を発生させる。補正回路 76はコントローラ78からの補正信号を用いて、A/ 30 D変換器75からのディジタル信号を処理し、入射光量 の不均一性を補正する。補正係数としては、周辺部を強 調する、あるいは中心部を低下させる、または両者を同 時に行うものが考えられる。補正された信号は信号処理 回路77を通して外部に読み出される。このような補正 を行うことにより、カメラ(撮像装置)の出力としては 画面全域にわたって均一のものが得られるようになる。 【0041】コントローラが出力する補正係数として は、絞り設定値に対するイメージセンサ上の空間分布を 1画素ずつROMに記憶しておくことも考えられるが、 この場合は非常に多くのデータをROMに蓄えておく必 要があり実用的ではない。そとで、カメラに使用するレ ンズとイメージセンサが決まれば、一義的に補正係数が 決まるため、補正係数を絞りのデータから発生できるよ う近似曲線を求めておき、その係数をROMに記憶させ るようにすればROMの容量を節約することができる。 【0042】ROMに記憶させる内容として、具体的に は、例えば、各F値における撮像素子中央部から撮像素 子端部までの信号出力の変化を近似曲線として求めたそ の係数、又は各F値におけるケラレの生じ始める位置と 50

酸ケラレの生じ始める位置から撮像素子端部までの信号 出力の変化を近似曲線として求めたその係数等が考えら わる

10

【0043】とのように、本実施例では、撮像時の絞り値に応じて、結像レンズのケラレによる入射光量の不均一性を補正できるような補正信号を発生し、との補正信号により撮像索子の出力信号を処理する構成としたので、画面全域にわたって均一な出力が得られる撮像装置を実現できる。

【0044】実施例4.上記第3の実施例ではディジタル処理で信号出力を均一化するものを示したが、アナログでも同様な処理が可能である。図10はアナログ処理で信号出力を均一化する本発明の第4の実施例による撮像装置の構成を示すブロック図である。図において、図9と同一符号は同一または相当部分であり、81はコントローラから発生したディジタルの補正係数に応じてケラレと逆の特性の信号を発生させる補正信号発生回路、82は前置信号処理回路74を経たイメージセンサ73の出力信号と補正信号発生回路81により発生された補正信号を掛け算する合成回路である。

【0045】次に動作について説明する。被写体からの 光束は、結像レンズ71によりイメージセンサ(撮像素 子) 73上に結像される。このとき絞り72は被写体の 明るさに応じて調整される。絞り72を開放側にすると 結像レンズ71の端部における光のケラレにより、イメ ージセンサの画面端部の入射光量が画面中央部の入射光 量より少なくなる。このため、前置信号処理回路74を 経たイメージセンサ73からの信号出力は図中の信号波 形Aに示すようにその画面中央部と画面端部とで不均一 なものとなる。一方、被写体の明るさに応じて調整され る絞り72の情報はコントローラ78に伝えられ、絞り 72の情報をもとにROM79から補正に関する情報が コントローラ78に読み出される。補正信号発生回路8 1はコントローラ78から与えられる補正係数に応じ て、図中の信号波形Bに示すような、ケラレと逆の特性 の信号を発生させる。そして、前置信号処理回路74で 得られる信号波形Aと、補正信号発生回路81で得られ る信号波形Bを、合成回路82で掛け算することによ り、Cで示されるような画面全域にわたって均一な出力 信号を得ることができる。

【0046】このように、本実施例においても、上記第3の実施例と同様、撮像時の絞り値に応じて、結像レンズのケラレによる入射光量の不均一性を補正できるような補正信号を発生し、この補正信号により撮像素子の出力信号を処理する構成としたので、画面全域にわたって均一な出力が得られる撮像装置を実現できる。

[0047]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、撮像 素子の各画素に入射する光を制限する遮光層の開口幅を 撮像素子の中央部で狭く撮像素子の端部で広くして、又 10

は、画紫部の中央部分の画紫に対応して設けられたマイクロレンズの曲率を画紫部の端部の画紫に対応して設けられたマイクロレンズの曲率よりも小さくして、結像レンズによるケラレを補正するようにしたから、各レンズ紋りに対し、全画面にわたって均一な出力を得ることができる効果があり、また、これにより結像レンズ系の周辺光のケラレによる信号出力の不均一を生ずることなく、同じサイズの撮像紫子を用いる場合の結像レンズの有効径を小さくすることを可能とでき、撮像装置の小型、軽量化が図れる効果がある。

【0048】また、この発明によれば、結像レンズの絞り値を入力とし、当該絞り値において結像レンズの周辺光のケラレにより生ずる撮像素子の各画素の信号出力の面内不均一を補正するための信号を出力する補正信号発生手段と、上記撮像素子の出力を上記補正信号発生手段が出力する信号を用いて補正する信号処理手段とを備えた構成としたので、各絞り時に、全画面にわたって均一な信号出力を得ることができる効果があり、また、これにより結像レンズ系の周辺光のケラレによる信号出力の不均一を生ずることなく、同じサイズの撮像素子を用い 20 る場合の結像レンズの有効径を小さくすることを可能とでき、撮像装置の小型、軽量化が図れる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】との発明の第1の実施例による撮像装置に用い られる撮像素子を示す断面構造図である。

【図2】撮像素子に入射する光の遮光膜によるケラレの 様子を示す図である。

【図3】 遮光膜の開口幅の変化による信号出力の変化と F値との関係を説明するための図である。

【図4】との発明の第2の実施例による撮像装置に用い 30 られる撮像素子を示す断面構造図である。

【図5】 遮光膜の開口幅の変化による集光率の変化とマイクロレンズの曲率との関係を説明するための図である。

【図6】マイクロレンズの曲率のの変化による信号出力の変化と F値との関係を説明するための図である。

【図7】との発明の第2の実施例による撮像装置に用い られる撮像素子の製造方法を示す断面工程図である。

【図8】各絞りにおける各画面位置での信号出力または 光強度を示す図である。 【図9】との発明の第3の実施例による撮像装置の構成を示すブロック図である。

【図10】この発明の第4の実施例による撮像装置の構成を示すブロック図である。

【図11】被写体をレンズにより結像する様子を示す模式的な光線図である。

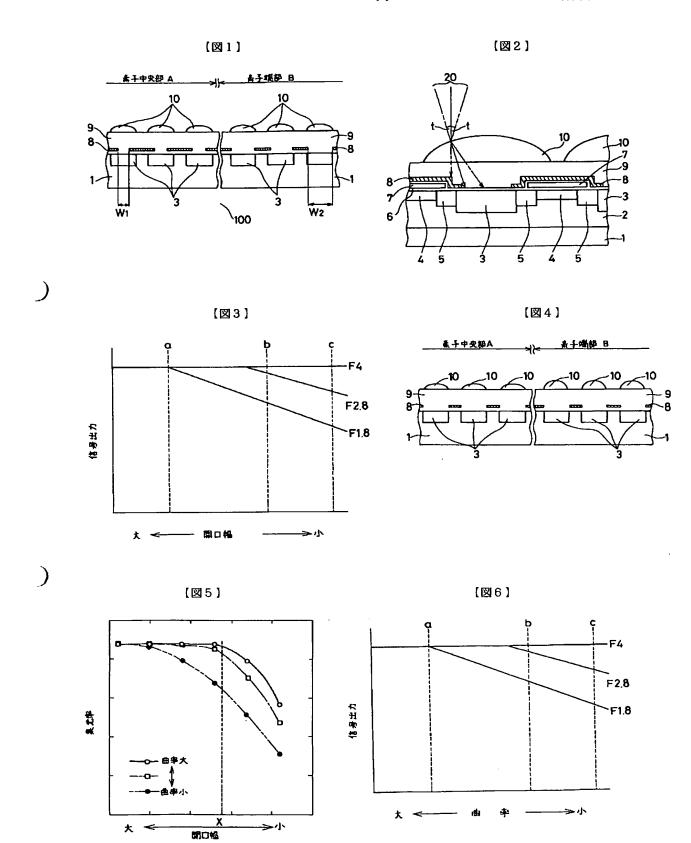
【図12】従来の撮像装置に用いられる撮像素子の構造 を示す断面図である。

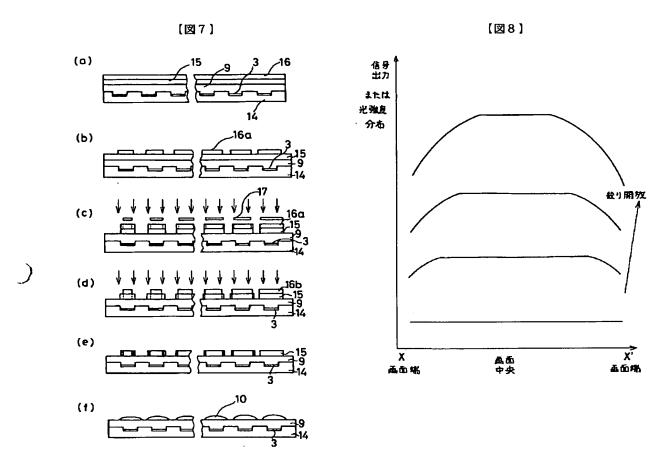
【図13】撮像紫子の画面位置を示すための図である。

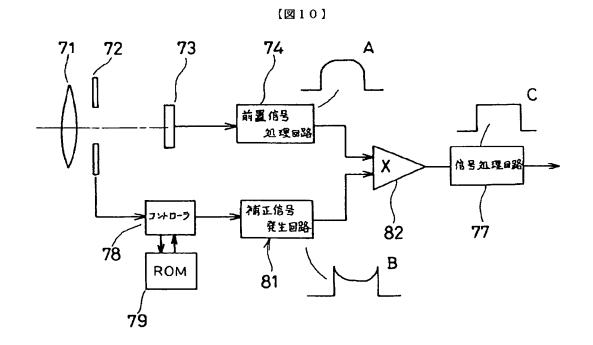
【図14】従来の撮像装置におけるF値と信号出力との 関係を示す図である。

【符号の説明】

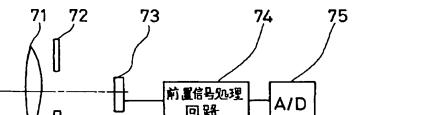
- 1 基板
- 2 ウェル
- 3 受光部
- 4 CCDチャネル
- 5 チャネル分離
- 6 ゲート絶縁膜
- 7 ゲート電極
- 8 遮光層
 - 9 平坦化層
 - 10 マイクロレンズ
 - 11 レンズ
 - 12 結像面
 - 13 射出瞳面
 - 14 基板
 - 15 マイクロレンズ材料
- 16 g線ポジ型レジスト
- 17 マスク
- 0 71 撮像用レンズ
 - 72 絞り
 - 73 イメージセンサ
 - 74 前置信号処理回路
 - 75 A/D変換器
 - 76 補正回路
 - 77 信号処理回路
 - 78 コントローラ
 - 79 ROM
 - 81 補正信号発生回路
- 40 82 合成回路

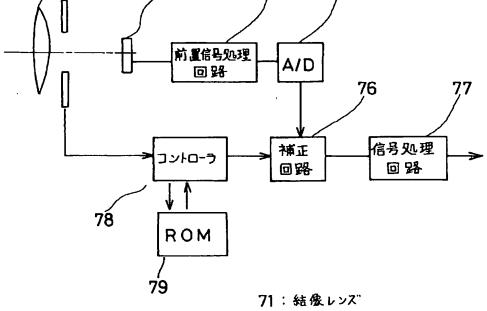




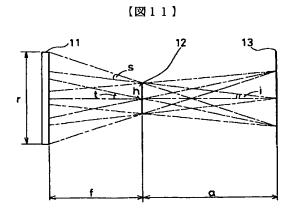


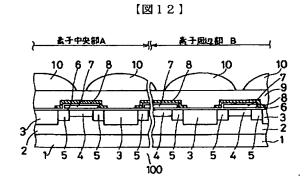
【図9】



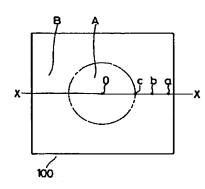


72:絞り 73: 摄像素子

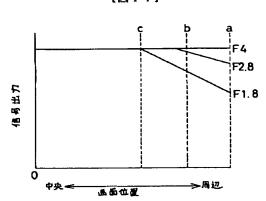




【図13】



【図14】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
☐ BLACK BORDERS	
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.